

SJ

中华人民共和国电子工业部部标准

SJ 2658—86

半导体红外发光二极管测试方法

1986—01—21 发布

1986—10—01 实施

中华人民共和国电子工业部 批准

目 录

SJ2658.1 - 86	半导体红外发光二极管测试方法	总则.....	1
SJ2658.2 - 86	半导体红外发光二极管测试方法	正向压降测试方法.....	3
SJ2658.3 - 86	半导体红外发光二极管测试方法	反向电压测试方法.....	5
SJ2658.4 - 86	半导体红外发光二极管测试方法	电容的测试方法.....	7
SJ2658.5 - 86	半导体红外发光二极管测试方法	正向串联电阻的 测试方法.....	9
SJ2658.6 - 86	半导体红外发光二极管测试方法	输出光功率的 测试方法.....	11
SJ2658.7 - 86	半导体红外发光二极管测试方法	辐射通量的 测试方法.....	13
SJ2658.8 - 86	半导体红外发光二极管测试方法	法向辐射率的 测试方法.....	15
SJ2658.9 - 86	半导体红外发光二极管测试方法	辐射强度空间分布和半强度角的 测试方法.....	17
SJ2658.10 - 86	半导体红外发光二极管测试方法	调制带宽的测试方法.....	19
SJ2658.11 - 86	半导体红外发光二极管测试方法	脉冲响应特性的 测试方法.....	21
SJ2658.12 - 86	半导体红外发光二极管测试方法	峰值发射波长和光谱半宽度的 测试方法.....	23
SJ2658.13 - 86	半导体红外发光二极管测试方法	输出光功率温度系数的 测试方法.....	25